

【主な試験項目】

- 透過型・走査型電子顕微鏡観察、EDXによる元素分析
- 核磁気・電子スピン共鳴装置測定
- 走査型X線光電子分光測定
- X線マイクロCTスキャン測定・再構成
- 誘導結合プラズマ発光分析 etc.



電解放出型走査電子顕微鏡
日立ハイテック S-4800



核磁気共鳴装置 JEOL ECZR600
Bruker AVANCE III 600MHz



走査型X線光電子分光測定
ULVAC-PHI, inc. Quantera SXM-GS



X線マイクロCTスキャン
Bruker Skyacn1172



誘導結合プラズマ発光分析
HORIBA ULTIMA2